**Nazwa przedmiotu:**

Aparatura w systemach zapewnienia jakości część II

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. Olga Iwasińska

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechatronika

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

**Semestr nominalny:**

6 / rok ak. 2009/2010

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 15h |
| Ćwiczenia:  | 0h |
| Laboratorium:  | 15h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Wymagana jest znajomość treści zawartych w przedmiotach: Fizyka, Matematyka w zakresie probabilistyki i statystyki, Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych Zarządzanie jakością, Podstawy metrologii, Metrologia techniczna.

**Limit liczby studentów:**

**Cel przedmiotu:**

Pogłębienie wiedzy na temat aparatury pomiarowej aktualnie stosowanej w przyśle do kontroli i monitorowania procesów produkcji. Systemy do kontroli czynnej i biernej procesów kształtujących poziom jakości wyrobów, w szczególności parametrów wymiarowych i wykorzystujących informacje geometryczne do sterowania procesami oraz paramentów fizycznych pośrednio wpływających na geometrię wyrobów. Zapoznanie się z metodami pomiarowymi stykowymi, bezstykowymi a także przykładowymi rozwiązaniami technicznymi

**Treści kształcenia:**

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat aparatury pomiarowej stosowanej w przyśle do kontroli i monitorowania procesów produkcji. Systemy do kontroli czynnej i biernej procesów kształtujących poziom jakości wyrobów, w szczególności parametrów wymiarowych i wykorzystujących informacje geometryczne do sterowania procesami oraz paramentów fizycznych pośrednio wpływających na geometrię wyrobów. Zapoznanie się z metodami pomiarowymi stykowymi, bezstykowymi a także przykładowymi rozwiązaniami technicznymi

**Metody oceny:**

egzamin

**Egzamin:**

**Literatura:**

Arendarski J.: Niepewność pomiarów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2006. Arendarski J., Gliwa-Gliwiński J., Jabłoński Z., Ratajczyk E., Tomasik J., Żebrowska-Łucyk S.: Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2003., Dietrich E, Schulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych. Notika System 2000.

**Witryna www przedmiotu:**

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe